

1023803



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

X 1,4,6,7,8  
INTERNATIONAL PATENT COOPERATION TREATY

⑪ Veröffentlichungsnummer:

**0 168 510**  
A1

⑫

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 84108325.8

⑤① Int. Cl.4: G 03 F 1/00

⑰ Anmeldetag: 16.07.84

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 22.01.86  
Patentblatt 86/4

⑦① Anmelder: IBM DEUTSCHLAND GMBH,  
Pascalstrasse 100, D-7000 Stuttgart 80 (DE)  
⑧④ Benannte Vertragsstaaten: DE

⑦① Anmelder: International Business Machines  
Corporation, Old Orchard Road, Armonk, N.Y. 10504 (US)  
⑧④ Benannte Vertragsstaaten: FR GB

⑦② Erfinder: Behringer, U., Dr. Dipl.-Phys.,  
Wolfsbergstrasse 27, D-7403 Ammerbuch 4 (DE)  
Erfinder: Bohlen, H., Dipl.-Phys., Hohenzollernring 46,  
D-7403 Ammerbuch (DE)  
Erfinder: Vettiger, P., Dipl.-Ing., Langmoosstrasse 33,  
CH-81365 Langnau/a. A. (CH)  
Erfinder: Zapka, W., Dr. Dipl.-Phys., Ritterstrasse 29,  
D-7031 Gärtringen-Rohrau (DE)

⑧④ Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB

⑦④ Vertreter: Kreidler, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Schönaicher  
Strasse 220, D-7030 Böblingen (DE)

⑧④ Verfahren zur Reparatur von Transmissionsmasken.

⑤⑦ Das Verfahren gemäß der Erfindung betrifft das Reparieren von Transmissionsmasken für die Röntgenstrahl-, Elektronenstrahl- bzw. Ionenstrahlolithographie. Hierzu wird in einem Vakuumsystem ein fein fokussierter Elektronenstrahl zeilenweise über eine unerwünschte Maskenöffnung oder am Rand der Maskenöffnung entlang geführt, um die Öffnung durch die dem Strahl folgenden Kontaminationsstreifen vollständig zu verschließen oder um die Form der Maskenöffnung zu korrigieren. Unter Einwirkung des Elektronenstrahls erfolgt eine Polymerisation von Monomerkulen, die aus dem Diffusionspumpenöl stammen oder im Bereich der Maske zudosiert werden. Das Polymergerüst kann nach dem Auffüllen der unerwünschten Maskenöffnung mit einem leitenden Material von der Rückseite der Maske her wieder entfernt werden. Anschließend wird eine Goldschicht auf die Vorder- und Rückseite der Maske aufgebracht.

Verfahren zur Reparatur von Transmissionsmasken

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reparieren von Transmissionsmasken für die Röntgenstrahl-, Elektronenstrahl- bzw. Ionenstrahlolithographie.

- 5 Der in der VLSI-Halbleitertechnologie anhaltende Trend zur Reduzierung der Schaltkreisdimensionen macht Lithographieverfahren und Belichtungssysteme erforderlich, die das Drucken von Mustern mit Dimensionen im Submikrometerbereich gestatten. Mit den bisher verwendeten
- 10 lichtoptischen Belichtungssystemen können diese Muster mit den gewünschten Submikrometerdimensionen wegen der geringen Fokussierungstiefe und der Streuung des Lichts an den Kanten der Masken nicht mehr hergestellt werden. Es ist deshalb erforderlich, zu Verfahren überzugehen,
- 15 bei denen nichtoptische Strahlungsarten mit viel kürzeren Wellenlängen als die in lichtoptischen Systemen eingesetzten verwendet werden. Als nichtoptische Strahlung werden derzeit Röntgenstrahlen, Elektronenstrahlen oder Ionenstrahlen eingesetzt.
- 20 Für die Belichtung mit Röntgenstrahlen, Elektronen- oder Ionenstrahlen müssen Transmissionsmasken mit Submikrometerstrukturen und einer hohen geometrischen Präzision, die für das Übereinanderdrucken erforderlich
- 25 ist, hergestellt werden. Die Masken für Elektronen- und Ionenstrahlolithographie sind, im Gegensatz zu Masken für optische Belichtung, die aus Chromstrukturen auf Glassubstraten aufgebaut sind, aus dünnen Folien oder Membranen aus Silicium oder Siliciumnitrid aufgebaut
- 30 und weisen in den transparenten Bereichen physikalische Löcher für den Durchlaß der Strahlung auf. Ihre Herstellung erfolgt in photolithographischen Prozessen, gefolgt von isotropen und streng anisotropen Ätz-

prozessen. Während des Herstellungsprozesses kann es dazu kommen, daß durch Staubteilchen oder noch viel häufiger durch eine Lochbildung in dem zu belichtenden Photoresist zusätzliche, unerwünschte Löcher auftreten. 5 Außerdem können durch Gitterfehler, die während der Bordotierung des Wafers, aus dem die Maske hergestellt wird, auftreten, beim selektiven Ätzprozeß zusätzliche Defektlöcher entstehen. Diese Defektlöcher sind unerwünscht, weil sie während des Herstellungsprozesses für 10 die Transmissionsmaske wie die gewünschten Strukturen eingätzt werden und damit die Maskenstrukturen verfälschen. Selbst bei besten Reinraumbedingungen kann das Auftreten dieser zusätzlichen Löcher nie ganz verhindert werden. Deshalb wurden Verfahren entwickelt, um 15 Transmissionsmasken zu reparieren.

Das in der lichtoptischen Lithographie verwendete Maskenreparaturverfahren, bei dem mit Hilfe eines Laserstrahls der Chromüberschuß an Maskenstrukturen weggenommen wird, bzw. Defektlöcher durch Aufpinseln von Photoresist per Hand geschlossen werden, kann zur Reparatur der betrachteten Transmissionsmasken nicht verwendet werden, weil die Reparatur nicht wie bei 20 lichtoptischen Masken an Vorlagen mit zehnfacher Vergrößerung, sondern an Transmissionsmasken, die alle Strukturen im Maßstab 1:1 enthalten, vorgenommen wird, wobei die Strukturen oft kleiner als  $0,5\ \mu\text{m}$  ausfallen. 25

Es wurde bereits ein Verfahren zur Reparatur fehlerhafter Transmissionsmasken vorgeschlagen, bei dem auf 30 die Oberseite der fehlerhaften Maske eine Photoresistschicht aufgetragen und alle Maskenlöcher, einschließlich der fehlerhaften, geschlossen werden. Anschließend wird die Photoresistschicht durch eine Transmissionsmaske, deren Struktur identisch mit der Struktur der zu 35

- reparierenden Maske ist, belichtet. Hierbei muß darauf geachtet werden, daß in der zur Belichtung verwendeten Maske etwa vorhandene Defektlöcher nicht an denselben Stellen wie bei der zu reparierenden Maske auftreten.
- 5 Weitere Fehler, die durch Defektstellen in der zur Reparatur verwendeten Maske bedingt sind, können dadurch ausgeschaltet werden, daß die Photoresistschicht auf der zu reparierenden Maske noch einmal durch eine
- 10 strukturgleiche Maske belichtet wird, wobei wiederum die Defektlöcher dieser Maske nicht mit den Defektlöchern in der zuvor benutzten Maske und der zu reparierenden Maske zusammenfallen dürfen. Dieses Verfahren hat den Nachteil, daß der auf der zu reparierenden Mas-
- 15 ke verbleibende Photoresist bei der späteren Belichtung der Maske zu Aufladungen führen kann, was unerwünscht ist. Außerdem ist die Anwendung dieses Reparaturverfahrens nur dann sinnvoll, wenn eine Inspektion der zu reparierenden Maske ergibt, daß viele Defektlöcher zu
- 20 schließen sind. Wenn, als Folge sehr guter Reinraumbedingungen, eine visuelle Inspektion der Masken ergibt, daß nur wenige Defektlöcher zu schließen sind, ist ein Verfahren vorteilhafter, mit dem einzelne Defektlöcher repariert werden können.
- 25 Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Verfahren zur Reparatur einzelner Defektlöcher in Transmissionsmasken anzugeben, das, weil in bereits vorhandenen Apparaturen durchführbar, sehr kostengünstig ist.
- 30 Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1.

Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen niedergelegt.

Bei dem erfindungsgemäßen Reparaturverfahren wird aus-  
genutzt, daß bei Bestrahlung einer im Vakuum befindli-  
chen Fläche eines Rasterelektronenmikroskops mit einem  
Elektronenstrahl im Auftreffpunkt des Strahls eine Koh-  
lenwasserstoff-Polymerisatschicht aufwächst. Dieser  
5 Effekt ist Elektronenmikroskopikern seit vielen Jahren  
bekannt und wird als Kontamination bezeichnet. Es wur-  
de auch der Mechanismus der Elektronenstrahlpolymerisa-  
tion von Kohlenwasserstoffmolekülen, welche am Substrat  
10 adsorbiert sind, untersucht und festgestellt, daß das  
Wachsen der adsorbierten Schicht aus der Dampfphase  
erfolgte und daß wesentliche Quellen für die Kohlen-  
wasserstoffmoleküle Diffusionspumpenöl, Gummidichtun-  
gen oder fettige Oberflächen waren. R.F.W. Pease und  
15 W.C. Nixon, in 1st Int. Conf. on Electron and Ion Beam  
Sci. and Tech. 1965, Seiten 220 bis 230, zeigten, daß  
sich im Weg eines Elektronenstrahls, wenn dieser auf  
eine Gitterkante fokussiert und langsam von ihr wegge-  
führt wurde, ein selbsttragender Kontaminationsfaden  
20 bildete. Der aus der Elektronenmikroskopie bekannte  
Kontaminationseffekt, der dort als störend empfunden  
wird, wird erfindungsgemäß zur Reparatur von Transmis-  
sionsmasken eingesetzt. In der zuvor abgehandelten Li-  
teraturstelle ist diese Anwendung nicht beschrieben.

25

Die Erfindung wird anhand der speziellen Beschreibung  
und der Figuren 1 bis 6 näher erläutert.

Es stellen dar:

30

Fig. 1                    einen Querschnitt durch eine Elektronen-  
strahl-Transmissionsmaske;

35

Fig. 2A                ein Verfahren zur Herstellung einer  
bis 2F                Transmissionsmaske;

Fig. 3 ein zu schließendes Loch in einer Maske mit zwei geschriebenen Brücken;

5 Fig. 4A eine Maske mit einem Defektloch neben einer gewünschten Maskenöffnung;

Fig. 4B eine Vergrößerung des Defektlochs von Fig. 4A;

10 Fig. 5A ein Defektloch mit mehreren geschriebenen Brücken;  
und 5B

Fig. 6A entspricht Fig. 4A;

15 Fig. 6B ein repariertes Defektloch neben einer Maskenöffnung gemäß Fig. 6A.

Die in Fig. 1 gezeigte Elektronenstrahl-Transmissionsmaske besteht aus einer einkristallinen Bor-dotierten Siliciummembran von etwa 2  $\mu\text{m}$  Dicke und einer Goldschicht auf ihrer Oberfläche, welche die strahlstoppenden Eigenschaften verbessert. Die Maske besitzt die Größe eines Siliciumwafers und enthält als feinste Strukturen Strukturen von 0,3  $\mu\text{m}$  Breite. Der gleiche Maskentyp kann auch für Ionenstrahl- oder Röntgenstrahlolithographie verwendet werden.

Anhand der Fign. 2A bis 2F wird ein Verfahren zur Herstellung einer Maske für die Elektronenstrahl-, Ionenstrahl- oder Röntgenstrahlolithographie beschrieben, bei dem Fehlstellen in der Maske auftreten können, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren repariert werden. Als Maskensubstrat wird gemäß Fig. 2A ein 0,2 bis 0,4 mm dicker Siliciumwafer mit einer 100-Orientierung, der auf beiden Seiten poliert ist, verwendet. Die Rückseite

des Wafers ist mit einer 0,5 bis 1  $\mu\text{m}$  dicken Siliciumdioxidschicht 2 bedeckt. Von der Vorderseite des Siliciumwafers wird Bor in das Substrat eindiffundiert bis zu einer Oberflächenkonzentration von wenigstens  $10^{20}$  Boratomen/ $\text{cm}^3$  (Schicht 3 in Fig. 2A). Die Bordiffusion dient als Ätzbarriere bei einem späteren Ätzen des Siliciumwafers und bestimmt dadurch die Maskenschichtdicke. Weiterhin bewirkt die Borkonzentration eine Zugspannung in der fertigen Maske, die ein Durchbiegen der Maske verhindert, wenn diese in ihrem starren kalten Siliciumrahmen erwärmt wird. Im nächsten Prozeßschritt (Fig. 2B) werden mehrere Fenster 4 von Chipgröße auf der Rückseite durch konventionelle Photolithographie und Naßätzen hergestellt. Durch diese Fenster wird später das Ätzen des Wafers vorgenommen. Auf die bordotierte Vorderseite des Wafers wird dann eine 0,4 bis 0,8  $\mu\text{m}$  dicke Siliciumdioxidschicht 5 aufgesputtert. Die Dicke der Siliciumdioxidschicht hängt von dem Ätzratenverhältnis von Siliciumdioxid zu Silicium im reaktiven Ionenätzprozeß zur Übertragung des Musters in das Silicium ab. In dem hier beschriebenen Verfahren wird eine Siliciumdioxidschichtdicke von 0,7  $\mu\text{m}$  verwendet. Anschließend kann für Siliciumdioxidschichtdicken unter 0,5  $\mu\text{m}$  auf die Siliciumdioxidschicht 5 eine einzige Photoresistschicht in einer Schichtdicke von 0,2 bis 0,5  $\mu\text{m}$  aufgetragen werden (nicht dargestellt). In Fig. 2B ist der für größere Siliciumdioxidschichtdicken angewendete Dreilagigen-Resistprozeß schematisch dargestellt. Dabei wird auf die Siliciumdioxidschicht 5 eine dicke Photoresistschicht 6 in einer Schichtdicke von 1 bis 2  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 1,6  $\mu\text{m}$  aufgesponnen. Als Photoresist wurde ein Positiv-Photoresist AZ 1350J der Firma Shipley, welcher aus einem Phenol-Formaldehyd-Harz und 3,4-Dihydroxybenzophenon-4-[naphthochinon-(1,2)diazid(2)]-sulfonat als reaktivem Bestandteil

besteht, aufgesponnen. Der Resist wird dann bei etwa 210°C 30 Minuten lang gehärtet. Auf die dicke Photoresistschicht 6 wird eine etwa 0,1 bis 0,2 µm dicke Siliciumnitridschicht 7 durch Plasmaabscheidung aufgetragen. Diese wiederum wird mit einer 0,3 bis 0,5 µm dicken hochempfindlichen Resistschicht 8 bedeckt. Durch Belichten und Entwickeln wird in dieser Resistschicht das gewünschte Maskenmuster erzeugt. Für Muster mit Dimensionen im Submikrometerbereich wird diese Belichtung mit einem Elektronenstrahlschreiber (vector scan) durchgeführt. Um eine vertikale Resistmaske zu erhalten, werden die entwickelten Strukturen (9a bis 9c) der Schicht 8 durch reaktives Ionenätzen mit  $\text{CF}_4$  bei einem Fluß von etwa  $30 \text{ cm}^3/\text{Min.}$ , einem Druck von  $67 \text{ µbar}$  und einer Energiedichte von  $0,2 \text{ Watt/cm}^2$  in die Siliciumnitridschicht 7 übertragen. Die strukturierte Siliciumnitridschicht 7 ist eine ausgezeichnete Maske für das reaktive Ionenätzen der dicken Resistschicht 6 in einer Sauerstoffatmosphäre und bewirkt gleichzeitig eine Verbesserung der Haftung des hochempfindlichen Resists 8 auf der Oberfläche. Das Muster in der Siliciumnitridschicht 7 wird in die darunterliegende Photoresistschicht 6 übertragen durch reaktives Ionenätzen mit Sauerstoff bei einem Fluß von etwa  $27 \text{ cm}^3/\text{Min.}$ , einem Druck von  $2,6 \text{ µbar}$  und einer Energiedichte von  $0,2 \text{ Watt/cm}^2$ . Die unterste Photoresistschicht 6 des Dreilagprozesses dient als Maske zum Ätzen der Siliciumdioxidschicht 5 (Fig. 2C). Das reaktive Ionenätzen erfolgt in einem Reaktor mit Dioden, wobei die Wafer auf einer an Betriebsspannung angelegten Elektrode angeordnet sind. Die Strukturierung der Siliciumdioxidschicht erfolgt durch reaktives Ionenätzen mit  $\text{CF}_4$  bei einem Fluß von  $30 \text{ cm}^3/\text{Min.}$ , einem Druck von  $67 \text{ µbar}$  und einer Energiedichte von  $0,15 \text{ Watt/cm}^2$ . Nach dem Strippen des restlichen Resists 6 wird die strukturierte Siliciumdioxid-

schicht 5 (Fig. 2D) in einem zweiten reaktiven Ionen-  
ätzprozeß als Maske verwendet, um ein Muster 10 von  
etwa 2 bis 4  $\mu\text{m}$  Tiefe in das bordotierte Silicium 3  
zu ätzen. In diesem Verfahrensschritt wird ein  $\text{SF}_6$ ,  
5  $\text{Cl}_2$  und Helium-Gemisch mit 5,3 Vol. %  $\text{Cl}_2$ , 2,6 Vol. %  
 $\text{SF}_6$ , Rest Helium mit einem Fluß von 40  $\text{cm}^3/\text{Min.}$ , einem  
Druck von 53  $\mu\text{bar}$  und einer Energiedichte von etwa  
0,2  $\text{Watt}/\text{cm}^2$  verwendet. Es werden hierbei Ätzenver-  
hältnisse zwischen Siliciumdioxid und Silicium von 1:5  
10 bis etwa 1:20, vorzugsweise von 1:14, erhalten. Durch  
das streng gerichtete Ätzen werden nahezu vertikale  
Siliciumseitenwände (Fig. 2D) erhalten. Zum Ätzen von  
Silicium sind auch andere Gase, beispielsweise Gas-  
mischungen mit einem Gehalt an Chlor und Argon oder  
15  $\text{CCl}_2\text{F}_2$  und  $\text{O}_2$  oder  $\text{SiF}_4$ ,  $\text{Cl}_2$ , Helium oder Argon ge-  
eignet.

Schließlich wird das Wafersubstrat durch die Öffnungen  
4 in der Siliciumdioxidschicht 2 auf der Rückseite des  
20 Wafers in einem Naßätzprozeß gerichtet geätzt. Die Ätz-  
lösung besteht aus Äthylendiamin, Brenzkatechin, Pyra-  
zin und Wasser. Das Ätzen hört auf bei einer Borkonzen-  
tration von  $7 \times 10^{19}$  Boratomen/ $\text{cm}^3$ . Die resultierende  
Maske aus der einkristallinen, bordotierten Membran ist  
25 etwa 2  $\mu\text{m}$  dick, in Abhängigkeit von der angewendeten  
Bordiffusion. Nach dem Entfernen der restlichen Sili-  
ciumdioxidschichten 2 wird die strukturierte Silicium-  
membran mit einer 0,2 bis 0,8  $\mu\text{m}$  dicken Goldschicht 12  
(Fig. 2F) belegt. Diese ist erforderlich, um einen  
30 Elektronenstrahl bis zu Energien von etwa 25 keV abzu-  
bremsen. Die Goldschicht kann entweder durch Aufdampfen  
oder Aufputtern aufgebracht werden. Wenn Gold aufge-  
sputtert wird, nehmen die Dimensionen der Maske gering-  
fügig ab.

Nachfolgend wird, ebenfalls anhand der Fign. 2B bis 2F, sowie der Fign. 3 bis 6 das erfindungsgemäße Reparaturverfahren beschrieben. Wird bei der Inspektion einer Transmissionsmaske ein unerwünschtes Loch festgestellt, so ist dies darauf zurückzuführen, daß in der obersten Photoresistschicht 8 (Fig. 2B) neben erwünschten Maskenöffnungen 9a auch ausgefranzte Maskenöffnungen 9b und, beispielsweise durch Staub, unerwünschte Maskenöffnungen 9c gebildet werden können. Die unerwünschten Öffnungen täuschen erwünschte vor und werden während des Herstellungsprozesses für die Transmissionsmasken ebenfalls in die darunterliegenden Schichten eingeätzt, so daß die wahre Maskenstruktur verfälscht wird. Auch durch optimale Reinraumbedingungen kann das Auftreten dieser zusätzlichen Löcher nie ganz verhindert werden. Es war deshalb dringend erforderlich, ein Verfahren zur Reparatur von Transmissionsmasken zu entwickeln.

Wird bei der Inspektion einer Transmissionsmaske (Fig. 2D) ein unerwünschtes Loch 9c oder ein ausgefranztes Loch 9b festgestellt, dann muß dieses geschlossen bzw. das ausgefranzte Loch korrigiert werden. Hierzu wird die Transmissionsmaske in ein normales handelsübliches Elektronenrastermikroskop anstelle einer Probe eingebracht. Die zu reparierende Maske kann dann wie eine normale Probe im Elektronenrastermikroskop betrachtet werden, was von Vorteil ist, weil für die Maskenreparatur nicht zusätzlich ein kompliziertes teures Gerät entwickelt oder angeschafft werden muß. Im Elektronenrastermikroskop herrscht ein Vakuum, das keineswegs als rein bezeichnet werden kann und einen Gesamtdruck im Bereich von etwa 0,133 bis 0,0133  $\mu$ bar aufweist. Bei dem erfindungsgemäßen Reparaturverfahren wird ausgenutzt, daß die im Vakuum befindlichen Kohlenwasserstoffmoleküle, die aus dem Diffusionspumpenöl stammen,

unter Einwirkung des Elektronenstrahls polymerisieren. Richtet man nämlich einen fein fokussierten Elektronenstrahl oder Ionenstrahl auf den Rand einer zu schließenden oder korrigierenden Maskenöffnung und läßt ihn  
5 langsam über die unerwünschte Maskenöffnung wandern, dann bildet sich ein selbsttragender Kontaminationsfaden, der dem Weg des Elektronenstrahls folgt. Schreibt man mehrere solcher Kontaminationsfäden 10 (Fig. 2E und Fig. 3) nebeneinander, so ist es möglich, das unerwünschte Maskenloch zu schließen. Es wurde festgestellt, daß sehr gute Ergebnisse mit den Kohlenwasserstoffmolekülen, die als Restgase in einem normalen Mikroskopvakuum vorhanden sind, erzielt werden können. Es können jedoch auch andere Monomermoleküle, beispielsweise  
15 Butadien, Acetylen oder Acrylnitril dem Vakuum zugeführt und unter Einwirkung eines Elektronenstrahls zur Polymerisation gebracht werden.

In einem speziellen Ausführungsbeispiel wird eine zu  
20 reparierende Maske in ein Elektronenrastermikroskop eingebracht und der Elektronenstrahl direkt neben das zu reparierende Loch auf der Maskenoberfläche fokussiert. Wesentlich ist, daß der Strahldurchmesser sehr gering ist, damit sein Verhältnis zur umgebenden Oberfläche sehr klein ist. Es wurde mit Elektronenstrahldurchmessern im Bereich von 10 bis 100 nm gearbeitet.  
25 Im Elektronenrastermikroskop wurde eine Vergrößerung von 5000 bis 20 000 und eine sehr langsame Schreibgeschwindigkeit von etwa 1 bis 50  $\mu\text{m}/\text{Min.}$  bei einem  
30 Vakuum im Bereich von etwa 0,0133  $\mu\text{bar}$  gewählt. Die langsame Führung des Elektronenstrahls ist notwendig, damit genügend Moleküle zum Aufbau der Fäden nachdifundieren können.

Fig. 3 zeigt ein zu schließendes Loch mit zwei Stegen.  
In Fig. 4A ist ein zu schließendes Loch neben einer ge-  
wünschten Maskenöffnung und in Fig. 4B das zu schlie-  
ßende Loch bei 10facher Vergrößerung dargestellt. In  
5 den Fig. 5A und B sind bereits mehrere Kontaminations-  
fäden über das zu schließende Loch gelegt. Fig. 6A ent-  
spricht Fig. 4A und zeigt noch einmal den Ausgangszu-  
stand, während in Fig. 6B nur noch die erwünschte Mas-  
kenöffnung zu sehen ist und die unerwünschte geschlos-  
10 sen ist.

Die Reparatur einer unerwünschten Maskenöffnung kann  
außer in dem Elektronenrastermikroskop auch mit einem  
Elektronenstrahlschreiber (vector scan) erfolgen. Hier  
15 werden entweder über das Loch Kontaminationsfäden ge-  
schrieben, oder der Elektronenstrahl wird am Lochrand  
entlang geführt und so ein Zuwachsen des Lochs er-  
reicht. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß vor der  
Reparatur eine Inspektion der Maske im gleichen Gerät  
20 vorgenommen werden kann. Die Inspektion der Maske ge-  
schieht durch einen Vergleich des vom Elektronenstrahl  
gefundenen Maskenlochs mit den im Computer vorhandenen  
Daten der Maskenstruktur. Wird auf diese Weise festge-  
stellt, daß es sich um ein unerwünschtes Maskenloch  
25 handelt, dann kann die Maske, ohne daß sie aus dem Ge-  
rät entnommen werden muß, an der entsprechenden Stelle  
gezielt repariert werden. Hierbei wird in einem ver-  
gleichbaren Vakuum wie im Elektronenrastermikroskop und  
mit einem Elektronenstrahl mit einem Durchmesser von 10  
30 bis 100 nm gearbeitet.

Sollten bei beiden Verfahren die aus dem Diffusionspum-  
penöl stammenden Kohlenwasserstoffmoleküle für die Mas-  
kenreparatur nicht ausreichen, dann kann in der Nähe  
35 des Maskenhalters zusätzlich ein Tropfen Öl angeordnet

werden, oder es kann in der Umgebung der Maske eine ölhaltige Atmosphäre dadurch erzeugt werden, daß Monomermoleküle über ein Nadelventil oder ein Kapillarröhrchen zugeführt werden. Außer den Kohlenwasserstoffmonomeren können auch, wie zuvor bereits ausgeführt, andere Monomermoleküle zugeführt werden.

Die schematische Darstellung gemäß Fig. 2E zeigt Fäden 10 aus Polymermaterial, die über ein ausgefrantes Maskenloch 9b bzw. über eine unerwünschte Maskenöffnung 9c geschrieben wurden. Das unerwünschte Maskenloch 9c wird, nachdem es auf der Oberseite verschlossen wurde, von der Rückseite her mit einem leitenden Material 11, beispielsweise einem Metall, ausgefüllt. Hierzu kann Gold verwendet werden, welches anschließend, wie aus Fig. 2F ersichtlich ist, auch auf die Vorder- und Rückseite der reparierten Siliciummaske zu einer Schicht 12 aufgesputtert oder aufgedampft wird. Die Kontaminationsfäden 10, welche zur Reparatur der fehlerhaften Maske verwendet wurden, können vor dem Aufdampfen der Goldschicht 12 von der Maske entfernt werden.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Verfahren zur Reparatur von Transmissionsmasken,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß man in einem Vakuumsystem einen fein fokus-  
sierten Elektronenstrahl zeilenweise über eine  
unerwünschte Maskenöffnung oder am Rand der Mas-  
kenöffnung entlang führt, um die Öffnung durch  
die dem Strahl folgenden Kontaminationsstreifen  
vollständig zu schließen oder um die Form der  
Maskenöffnung zu korrigieren.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Maskenreparatur in einem Elektronenraster-  
mikroskop oder mit einem Elektronenstrahlschreiber  
(vector scan) durchgeführt wird.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Maskenreparatur in einem Vakuum im Bereich  
von 0,133 bis 0,0133  $\mu$ bar durchgeführt wird.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Maskenreparatur mit einem Elektronenstrahl  
mit einem Strahldurchmesser im Bereich von 10 bis  
100 nm durchgeführt wird.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß man den Elektronenstrahl mit einer Schreibge-  
schwindigkeit von 1 bis 50  $\mu$ m/Min. über die uner-  
wünschte Maskenöffnung führt.

6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß man in der Umgebung der Maske eine Monomer-  
molekülhaltige Atmosphäre erzeugt.
- 5
7. Verfahren nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß Monomere aus der Gruppe von Kohlenwasserstoff-  
molekülen, Butadien, Acetylen oder Acrylnitril  
eingesetzt werden.
- 10
8. Verfahren nach den Ansprüchen 6 und 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Monomermoleküle über ein Nadelventil oder  
ein Kapillarröhrchen in der Umgebung der Maske zu-  
dosierte werden oder in Form eines Tropfens auf den  
Maskenrand zugegeben werden.
- 15
9. Verfahren nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß Kohlenwasserstoffmoleküle, die aus dem Diffu-  
sionspumpenöl stammen und im Restvakuum vorhanden  
sind, durch den Elektronenstrahl polymerisiert  
werden.
- 20
10. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die reparierte Maskenöffnung von der Rückseite  
der Maske her mit einem leitenden Material aufge-  
füllt, das mit dem Elektronenstrahl aufgetragene  
Polymergerüst entfernt und auf Vorder- und Rück-  
seite der Maske eine Goldschicht aufgedampft oder  
aufgesputtert wird.
- 25
- 30

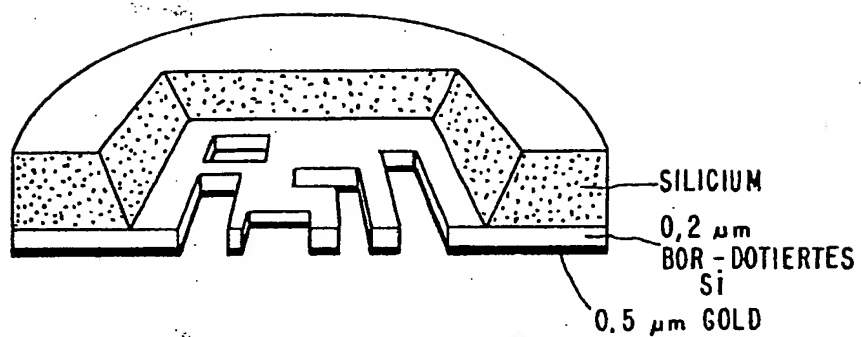


FIG. 1

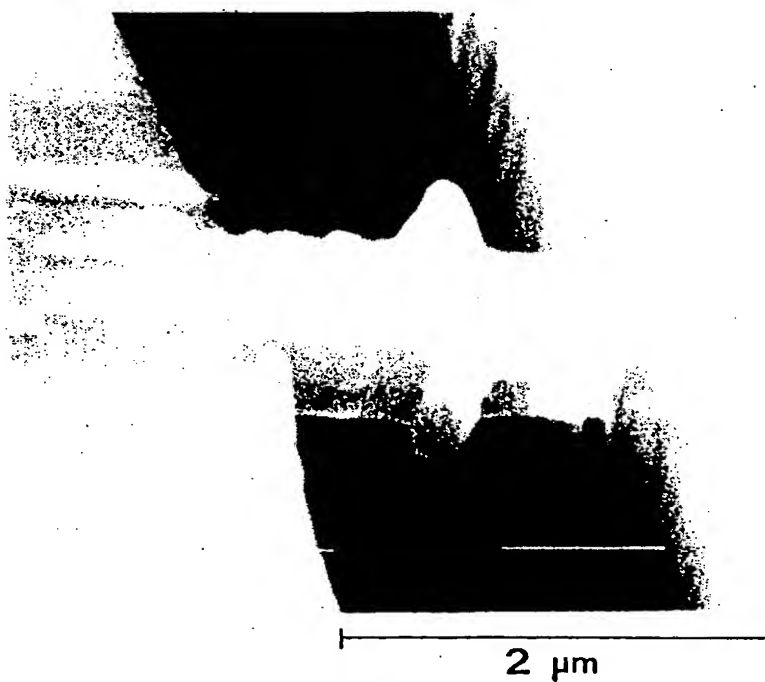


FIG. 3

FIG. 2A

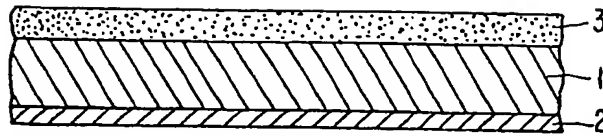


FIG. 2B

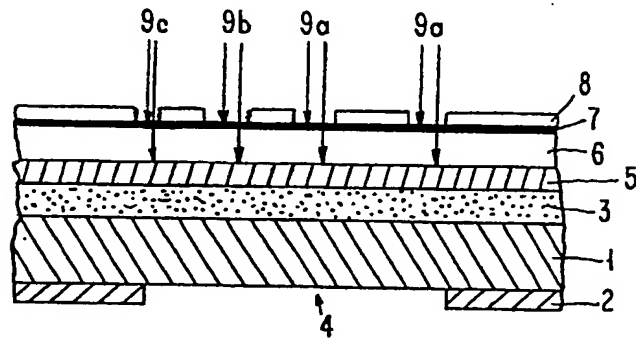


FIG. 2C

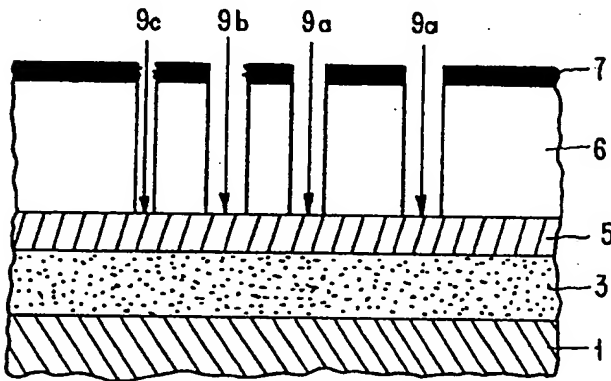


FIG. 2D

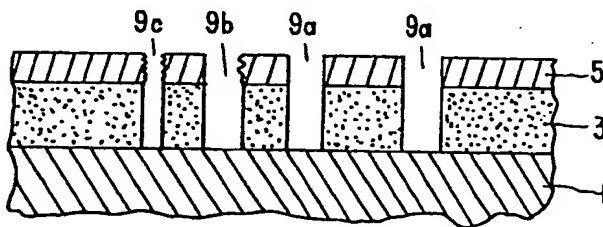


FIG. 2E

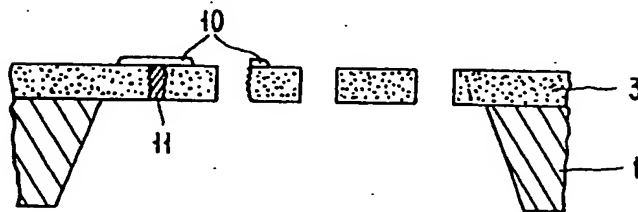
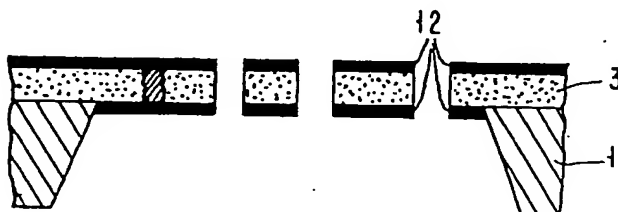


FIG. 2F



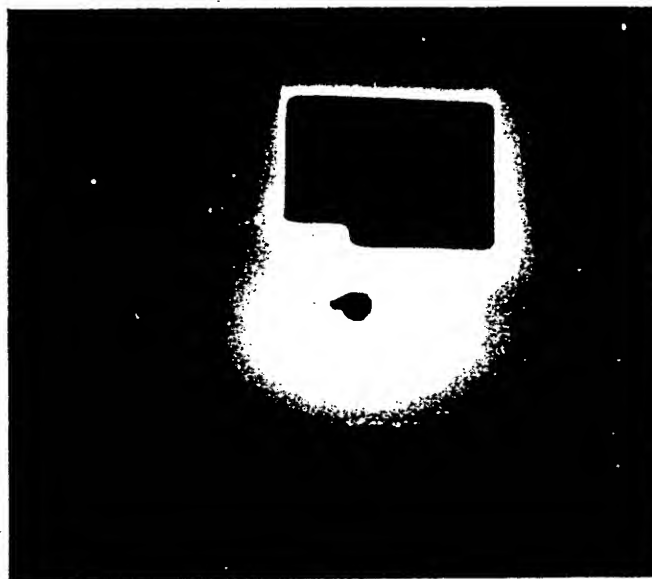


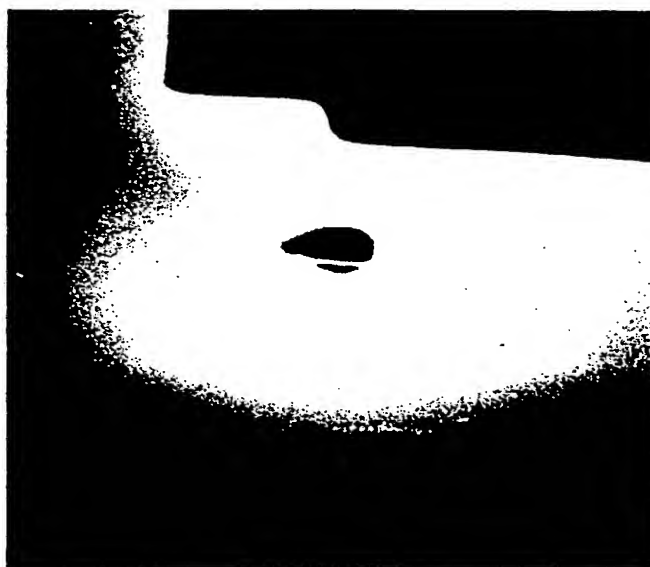
FIG. 4A

10  $\mu\text{m}$



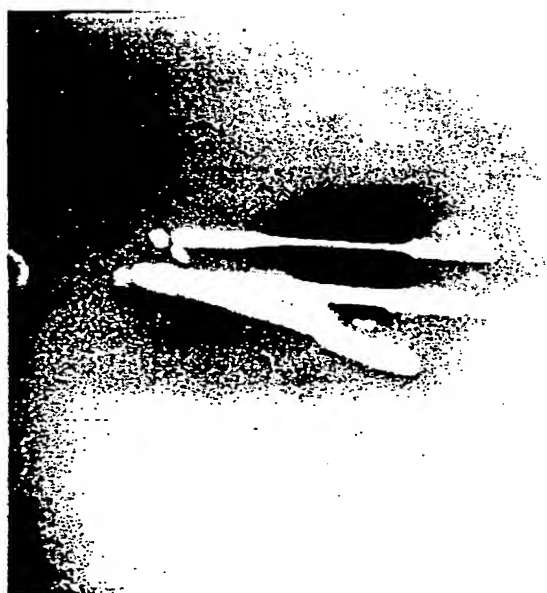
FIG. 4 B

1  $\mu\text{m}$



5  $\mu\text{m}$

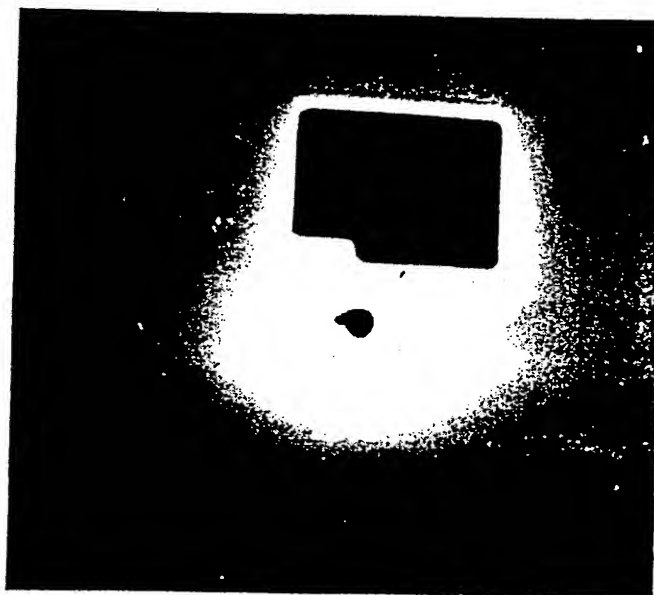
FIG. 5 A



2  $\mu\text{m}$

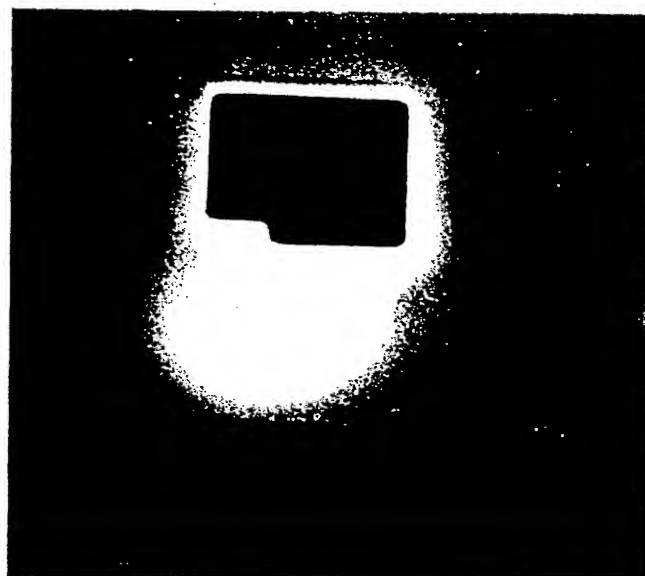
FIG. 5 B

FIG. 6A



10  $\mu\text{m}$

FIG. 6 B



10  $\mu\text{m}$



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0168510

Nummer der Anmeldung

EP 84 10 8325

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	APPLIED PHYSICS LETTERS, Band 29, Nr. 9, 1. November 1976, Seiten 596-598, American Institute of Physics, US; A.N. BROERS u.a.: "Electron-beam fabrication of 80-A metal structures" * Insgesamt *  -----	1	G 03 F 1/00
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			G 03 F 1/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 19-03-1985	
		Prüfer RASSCHAERT A.	
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze  E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument  & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Docket # MON-IT-489  
Applic. # 101614, 429  
Applicant: Christof Schick, et al.

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

## Process to repair transmission masks

**Patent number:** EP0168510  
**Publication date:** 1986-01-22  
**Inventor:** BEHRINGER U DR DIPL-PHYS; BOHLEN H DIPL-PHYS; VETTIGER P DIPL-ING; ZAPKA W DR DIPL-PHYS  
**Applicant:** IBM DEUTSCHLAND (DE); IBM (US)  
**Classification:**  
- **international:** G03F1/00  
- **european:** G03F1/00Z  
**Application number:** EP19840108325 19840716  
**Priority number(s):** EP19840108325 19840716

**Also published as:**

JP61032426 (A)  
EP0168510 (B)

**Abstract of EP0168510**

1. Method of repairing transmission masks using contamination polymerisation, characterized in that in a vacuum system a precisely focused electron beam is moved line by line over an undesired mask opening or along the edge of the mask opening in order to close the opening completely by the contamination filament following the beam, or to correct the form of the mask opening, and in that the repaired mask opening is replenished from the mask back with a conductive material, that the polymeric structure applied with the electron beam is removed, and a gold layer is vapor deposited or sputtered onto the front and back of the mask.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Docket # M&N-IT-439  
Applic. # 10/614,429  
Applicant: Schilz et al.

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**